

機器分析ワークショップ

11/10(水)福岡・11/24(水)鹿児島 2都市開催!

参加無料!!

主催：日本分析化学会九州支部、共催：(株)日本分光、(株)リガク、
(株)島津製作所、(株)ジェイ・サイエンス西日本、後援：サーモフィッシャー
サイエンティフィック(株)、エーエムアール(株)、日本ダイオネクス(株)(順不同)

FT/IRの基礎と分析手法の紹介(日本分光)

FT/IR分析の基礎的な部分から最近の分析手法までを
アプリケーションを交えて紹介します。測定でお困りの
ことがあれば、ご相談をお受けすることも可能です。

問合せ：伊与田 kyushu-sc@jasco.co.jp

TEL: 092-588-1931, FAX: 092-588-1932



顕微赤外システム

X線回折の基礎と応用(リガク)

粉末X線回折の基本原則から多様な
サンプルの測定テクニックまでを
理解できるよう詳細に解説します

問合せ：佐々木 s-sasaki@rigaku.co.jp

TEL: 092-541-5111, FAX: 093-541-5288



表面を観る(島津製作所)

~ 各種顕微鏡の最新トピックスのご紹介 ~

SEM, SPM, OLS, SFTなどそれぞれ
特徴のある各種顕微鏡の原理や
最新アプリケーションの紹介を行います

問合せ：吉田 yosisama@shimadzu.co.jp,

TEL: 092-283-3332, FAX: 092-283-3342



走査型プローブ顕微鏡

新技術『かさずだけ』のMS直接分析と広範囲 イオンクロマトグラフィー(ジェイ・サイエンス西日本)

- (1)地域性・大陸性微量環境物質のオンサイト分析への
挑戦(鹿児島会場)
- (2)前処理不要な直接イオン化(DART)によるMS分析の
紹介(新技術)
- (3)高分解能質量分析計(ベンチトップ電場型FT-MS)
環境試料分析の紹介
- (4)様々な分野で使われるイオンクロマトグラフィー



AMR社DART(Direct Analysis in Real Time)イオンソース

問合せ：福岡会場 川上 kawakami@js-n.co.jp または 松尾 matsuo@js-n.co.jp

TEL: 092-611-9161, FAX: 092-611-9165

鹿児島会場 竹迫 k.takesako@nifty.com TEL: 099-268-1773, FAX: 099-269-7058

参加申し込み方法は裏面をご覧ください

機器分析ワークショップ 参加申込書

機器分析ワークショップ参加ご希望の方は、下記項目を記入し、参加予定の地区・テーマの にチェックした上で、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。参加費は無料です。なお、定員に達し次第、申し込み受付を締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

勤務先・大学:

氏名:

所属・部課・学部:

TEL:

FAX:

E-mail:

住所:〒

福岡会場(11月10日)
福岡大学文系センター棟
4階第4会議室

鹿児島会場(11月24日)
鹿児島大学産学官連携推進機構
1階ディスカッションルーム

 9:00 ~ 10:30 9:00 ~ 10:30FT/IRの基礎と分析手法の紹介
(日本分光) 10:40 ~ 12:10 10:40 ~ 12:10

X線回折の基礎と応用(リガク)

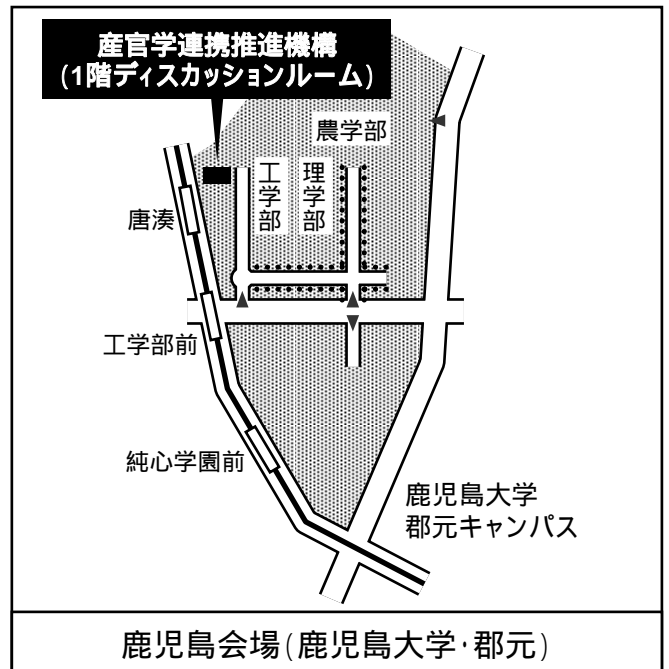
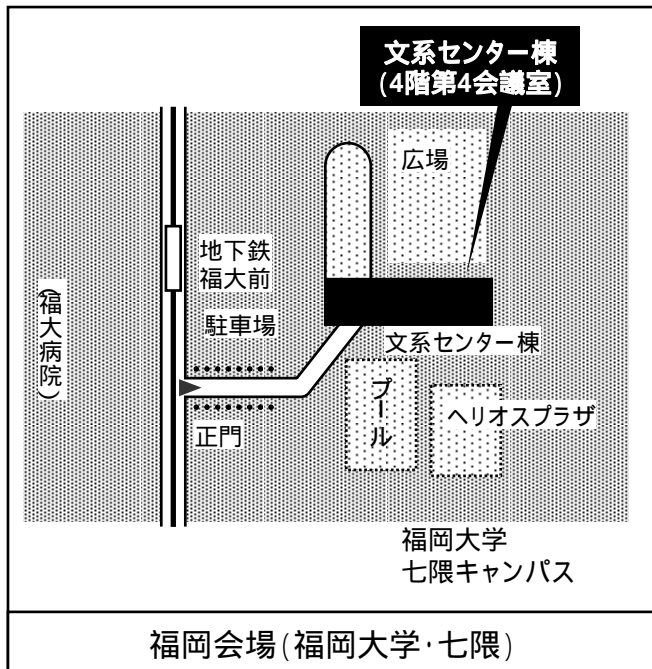
 13:00 ~ 14:00 13:00 ~ 14:00

表面を観る(島津製作所)

 14:10 ~ 16:10 14:10 ~ 16:10新技術『かさずだけ』のMS直接分析と
広範囲イオンクロマトグラフィー
(ジェイ・サイエンス西日本)

【11月5日締め切り】

【11月17日締め切り】



参加申込書送付先・機器分析ワークショップに関するお問い合わせ:

神崎(鹿児島大学大学院理工学研究院)E-mail: kanzaki@sci.kagoshima-u.ac.jp

TEL: 099-285-8106, FAX: 099-259-4720